



直接訪問產品

- 带有平行吸引真空盒的真空测试适配器
- 坚固耐用, 便于维护, 使用寿命出色
- 易用性提升, 操作直观简便
- 壳体易触及, 开口角度大
- 真空盒可以分别单独升级为 2 级接触的真空盒
- 在组装以未组装状态交付的物品时, 应使用零件清单中指定物品的图纸

使用

真空测试治具 (VA) 适用于对数量较大而变型数量少的印刷电路板进行触探。

规格

- 探针支撑板由 10 mm 厚、抗弯的 FR4 制成
- 压板由 6 mm 厚的 FR3 制成, 具有 ESD 导电表面, 包括 4 个系留式紧固件螺丝。
- 无需工具即可触及探针支撑板, 便于更换旧探针
- 用工具 (TORX T20) 打开外壳
- 可折叠提手, 便于安全舒适的运输

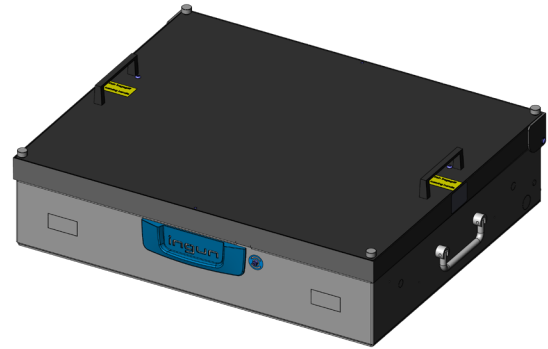
交付

交付时已部分安装。外壳在已安装状态下交付, 而真空盒内含须专门针对被测期间加工的部件, 所以在未安装状态下交付。

一般数据

测试系统接口:	未预配置
产品组:	真空测试治具 (VA)
主系列:	VA xxxx
子系列:	VA 40xx
结构系列:	VA 4040
尺寸:	xx40
治具类型:	单件治具
触探行程实施:	真空
外壳类型:	扁平外壳
触探装置方向:	1 级/2 级
最大接触力:	16.000 N
平行触探行程约:	12,8 mm
重量:	11,5 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
RoHS 符合性:	是

NEW



提示:

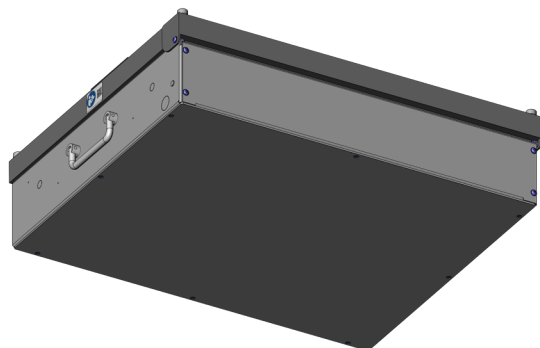
为了正确拆卸 VA 40xx 真空测试适配器, 请使用 1 级拆卸图 INFO 4630 或 2 级拆卸图 INFO 4638。

技术数据

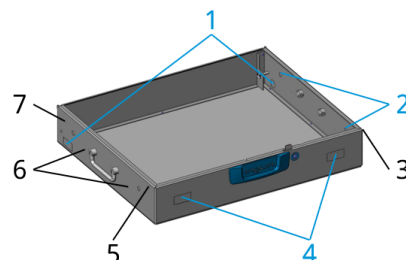
下部探针安装高度:	16 mm
下部 2 级探针安装高度:	21,3 mm
Force of gas pressure springs:	400 N (200 N 左/ 200 N 右)
标准规格:	是
标准有效面积 (宽x深):	460 x 340 mm
静电放电 (ESD) 规格:	否
高频规格:	否
刚性滚针规格:	否
2 级规格:	是, 采用合适的附加选项
2 级有效面积 (宽x深):	435 x 340 mm
上部附加触探装置 (ZSK):	是, 采用合适的附加选项
外部尺寸, 闭 (宽x深x高):	575 x 465 x 167 mm



直接訪問產品



Housing perforations and pilot holes



Perforated for:

- 1. Cable connections
- 2. Additional handles
- 4. Stroke counter

Prepared for:

- 3. ESD discharge button
- 5. Anti-pinch protection
- 6. Alum-A handles
- 7. Earthing contact

Accessories

Part no.	Designation	Version
114715	FB-2VE-VA4040	Dual-stage shifting unit
100974	VD-V-4040-2	Vakuumdichtung außen
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vacuum seal vacuum-free zone (fixed dimensions)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vacuum seal vacuum-free zone (variable dimensions)
31788	GDF-185-60-200N-A6-A6	Gas pressure spring
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Pressure spring
2599	HBS-03,0-10,0	Stroke-limiting disk
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter
113481	FB-TWA	Alum-A transport bracket
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD discharge probe
115943	MAP VA4040	Ground plate

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467 Konstanz, 德国
 中央办公室: +49 7531 8105-0
 客户热线: +49 7531 8105-888
 传真 +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
 保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
 测试器具套件

